

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0126542
Titolo	Electrical Atomic Force Microscopy for Nanoelectronics / Umberto Celano editor
Pubbl/distr/stampa	Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica	XX, 408 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina	621.36 543.5 530 502.82 620.5 621.381
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia